

Identifying NBTI-critical paths in nanoscale logic

Ubar, Raimund-Johannes; Vargas, Fabian; **Jenihhin, Maksim**; **Raik, Jaan**; **Kostin, Sergei**; Bolzani Poehls, Leticia 16th Euromicro Conference series on Digital System Design : DSD 2013 : proceedings : 4-6 September 2013, Santander, Spain 2013 / p. 136-141 : ill

Võrkplaneerimine tööstusettevõttes

Talts, Vello Tootmise organiseerimine tööstusettevõtetes 1974 / lk. 114-126 https://www.eester.ee/record=b1250116*est